

【11】證書號數：I502549

【45】公告日：中華民國 104 (2015) 年 10 月 01 日

【51】Int. Cl. : G06T7/00 (2006.01)

發明

全 3 頁

【54】名稱：元件影像檢測方法及其系統

RECOGNITION METHOD AND SYSTEM FOR COMPONENT IMAGES

【21】申請案號：101105537

【22】申請日：中華民國 101 (2012) 年 02 月 20 日

【11】公開編號：201335890

【43】公開日期：中華民國 102 (2013) 年 09 月 01 日

【72】發明人：王敬文 (TW) WANG, JING WEIN

【71】申請人：國立高雄應用科技大學

NATIONAL KAOHSIUNG

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

高雄市三民區建工路 415 號

【74】代理人：顏豪呈

【56】參考文獻：

TW 201037267A

US 7355692B2

US 2008/0285840A1

US 2010/0329535A1

Chung K. L., Shen C. H., and Chang L. C. (2001), "A novel SVD-
and VQ-based image hiding scheme", Pattern Recognition

Letters, Vol. 22, pp. 1051-1058.

審查人員：林文琦

[57]申請專利範圍

1. 一種元件影像檢測方法，其包含：輸入至少一原始元件影像；利用一奇異值分解法直接應用於該原始元件影像之奇異值分解處理，以獲得一分解元件影像；及利用該分解元件影像進行影像檢測或辨識。
2. 依申請專利範圍第 1 項所述之方法，其中以一光線補償法計算至少一光線補償係數；利用該光線補償係數進行光線補償處理該原始元件影像，以獲得一光線補償元件影像；利用該光線補償元件影像進行影像檢測或辨識。
3. 依申請專利範圍第 1 項所述之方法，其中在分解該原始元件影像時，在一 RGB 色域空間進行奇異值分解。
4. 依申請專利範圍第 3 項所述之方法，其中在該 RGB 色域空間進行奇異值分解時，在每一色域通道進行奇異值分解。
5. 依申請專利範圍第 3 項所述之方法，其中在該 RGB 色域空間進行奇異值分解時，分別計算用於 R 色域通道之光線補償係數、G 色域通道之光線補償係數及 B 色域通道之光線補償係數。
6. 一種元件影像檢測系統，其包含：一輸入單元，其用以輸入至少一原始元件影像；一演算單元，其利用一奇異值分解法直接應用於該原始元件影像之奇異值分解處理，以獲得一分解元件影像；及一輸出單元，其用以輸出該分解元件影像，以便進行影像檢測或辨識。
7. 依申請專利範圍第 6 項所述之系統，其中以一光線補償法計算至少一光線補償係數；利用該光線補償係數進行光線補償處理該原始元件影像，以獲得一光線補償元件影像；利用該光線補償元件影像進行影像檢測或辨識。

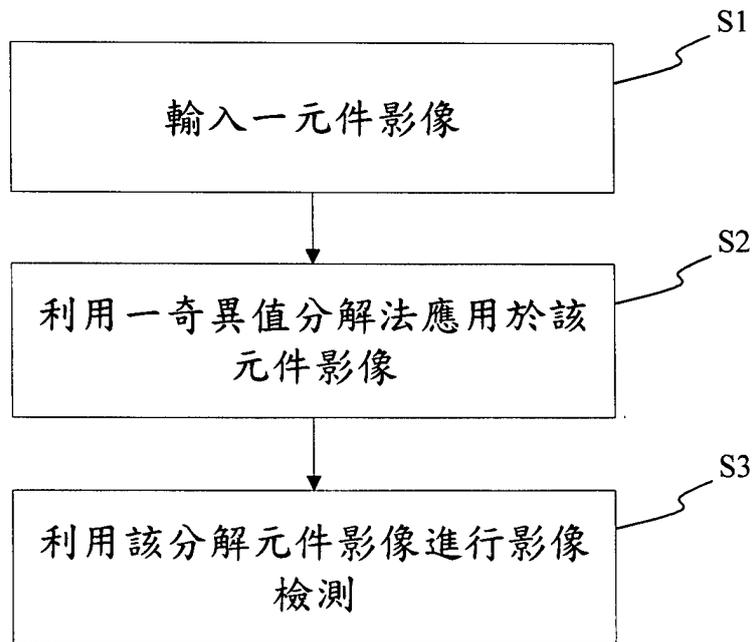
(2)

8. 依申請專利範圍第 6 項所述之系統，其中在分解該原始元件影像時，在一 RGB 色域空間進行奇異值分解。
9. 依申請專利範圍第 8 項所述之系統，其中在該 RGB 色域空間進行奇異值分解時，在每一色域通道進行奇異值分解。
10. 依申請專利範圍第 8 項所述之系統，其中在該 RGB 色域空間進行奇異值分解時，分別計算用於 R 色域通道之光線補償係數、G 色域通道之光線補償係數及 B 色域通道之光線補償係數。

圖式簡單說明

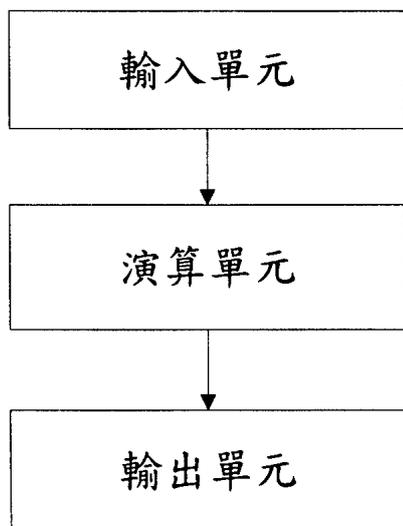
第 1 圖：本發明較佳實施例之元件影像檢測方法之示意圖。

第 2 圖：本發明較佳實施例之元件影像檢測系統之示意圖。



第1圖

(3)



第2圖